

インレンズ形FE-SEM SU9000による 極低加速電圧観察

◎ リターディング機能*の特長 (Advantage of deceleration function(option))

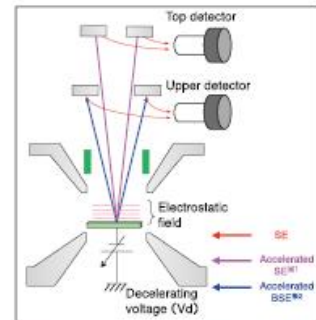
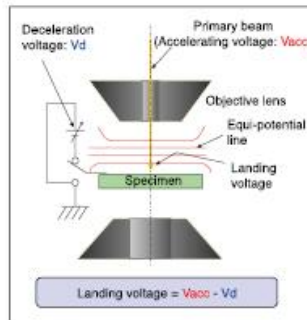


- 高分解能観察 High resolution imaging at low voltage (1.2 nm → 0.8 nm at 1 kV)
- 低ダメージ観察 Reducing the electron beam damage (Minimum landing voltage : 0.1 kV)
- 試料極表面の観察 Topmost surface imaging of the specimens

*オプション

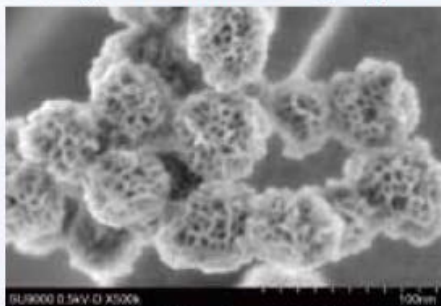


SU9000

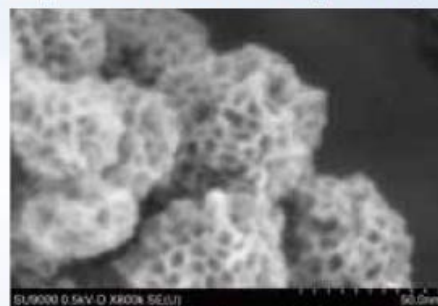


Signal detecting system in deceleration mode

◎ メソポーラスシリカナノ粒子の高分解能観察例 (High resolution imaging of Mesoporous silica nanospheres)



Magnification : x500 k

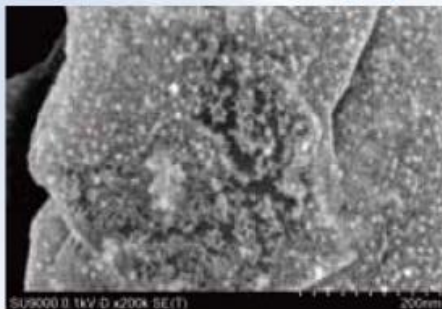


Magnification : x800 k

Landing voltage : 0.5 kV

試料ご提供：
東京工業大学 横井 俊之先生
Specimen courtesy
Dr. Toshiyuki Yokoi, Tokyo
Institute of Technology

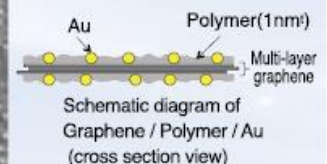
◎ Graphene / Polymer / Auの極表面観察例 (Topmost surface imaging of Graphene / Polymer / Au)



Top detector image



Upper detector image

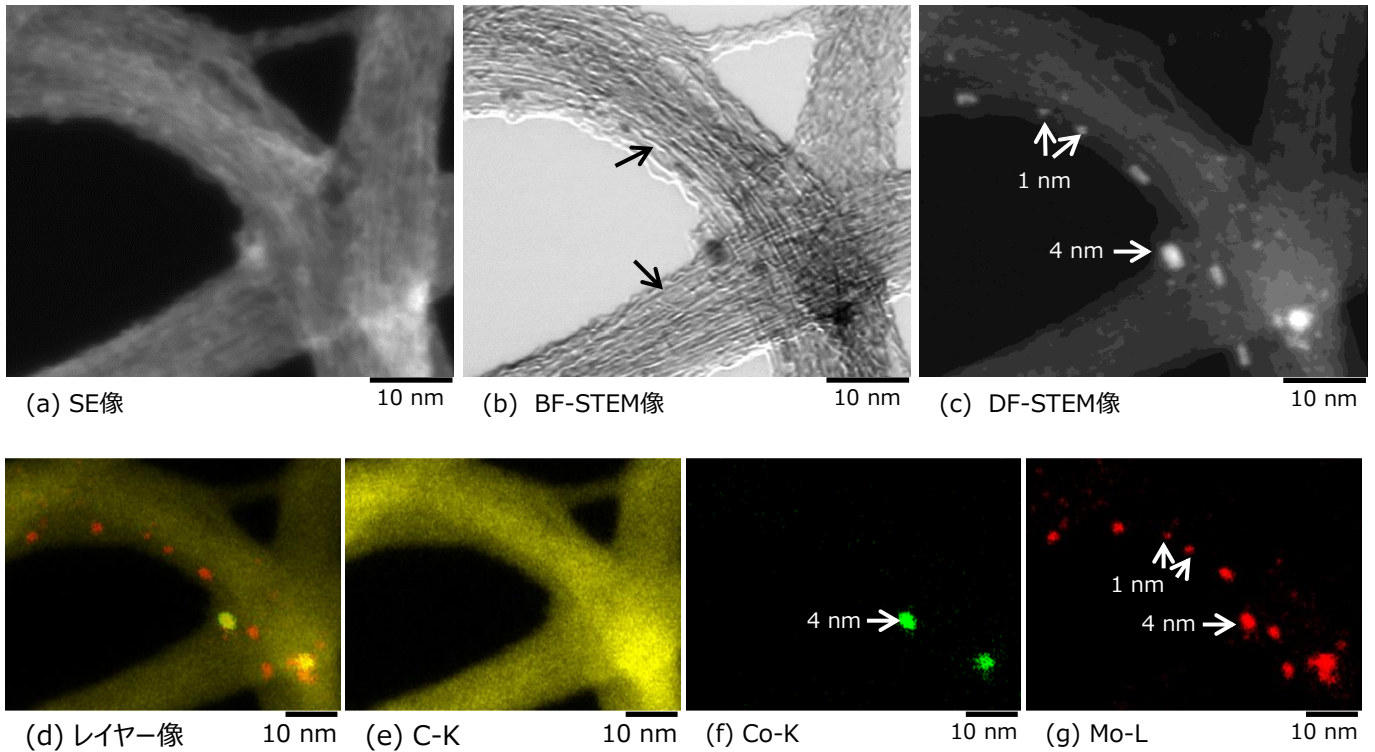


Landing voltage : 0.1 kV

試料ご提供：九州大学 大学院 応用化学部門 准教授 藤ヶ谷 剛彦先生

Specimen courtesy : Tsuyohiko Fujigaya, Associate Professor, Department of Applied Chemistry Graduate School of Engineering, Kyushu University

単層カーボンナノチューブの観察・EDXマッピング結果



試料：単層カーボンナノチューブ
 加速電圧：30 kV 倍率：x 2,000k

超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 SU9000の主な仕様

分解能	二次電子分解能*1	0.4 nm (加速電圧 30 kV)	
		0.8 nm (照射電圧 1 kV)	
	STEM分解能*2	0.34 nm	
倍率表示	表示方法の切替機能	写真倍率*3	実表示倍率*4
	低倍率モード	80~10,000倍	220~25,000倍
	高倍率モード	800~3,000,000倍	2,200~8,000,000倍
光学系	電子銃	冷陰極電界放出形電子銃	
	加速電圧	0.5~30 kV (0.1 kVステップ)	
	レンズ系	3段電磁レンズ縮小系	
	対物レンズ絞り	可動絞り (加熱タイプ、真空外より4孔切替及び微調整可能)	
	電氣的視野移動	±5 μm (Sample Height = 0.0 mm)	
	ビームブランキング	走査信号同期式ハイスピードブランキングシステム搭載	

* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

株式会社 日立ハイテク

本社 〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 電話03-3504-6111
 インターネットでも製品紹介しております。 URL www.hitachi-hightech.com/jp/science/



~ 最新のWEBセミナー・イベントはこちらから ~

日立ハイテク セミナー

